

# 飛行時間型二次イオン質量分析装置 (TOF-SIMS)

**主なスペック:** Biイオン銃、スパッタ用Arイオン銃、TRIFT型質量分析器

**装置の特徴:** 試料表面から深さ方向に存在するイオン計測&分布量測定

**主な対応試料:** 無機物、有機物

**担当:** 表面・バルク分析ユニット 宮内直弥



装置HP

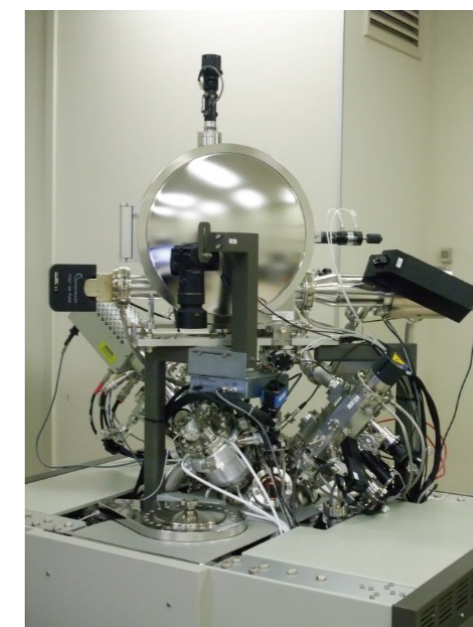


図1: TOF-SIMS

## 装置概要・アピールポイント

- 固体試料にイオンビーム(一次イオン)を照射し、試料表面から放出されるイオン(二次イオン)の飛行時間を利用して質量分析する装置。
- 試料表面(1 nm以下)の元素または分子種に関する情報を高感度に元素分析。
- イメージングおよびスパッタイオン銃との組み合わせによる深さ方向元素分析。
- 無機物・有機物を問わない幅広い試料への適用が可能(特に有機物に対しては、クラスターイオンを用いることでソフトにイオン化し、フラグメントパターンから元分子を推測できる)
- トランスファーベッセルを用いた大気非暴露計測に対応。

## 測定例

